# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-124395 (P2000-124395A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

日01L 25/065 25/07

25/07 25/18 H01L 25/08

В

Z

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顏平10-286410

(22)出願日

平成10年10月8日(1998.10.8)

(71)出願人 598073372

大衆電腦股▲ふん▼有限公司

台灣台北市敦化北路201-24號台塑後棟6

樓

(72)発明者 陳 宗杰

台灣台北市東閩街66巷37弄31號

(74)代理人 100082304

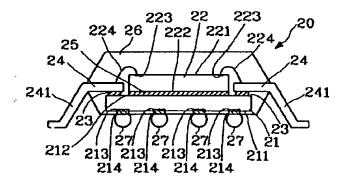
弁理士 竹本 松司 (外4名)

## (54) 【発明の名称】 多チップ半導体パッケージ構造とその製造方法

# (57)【要約】

【課題】 多チップ半導体パッケージ構造とその製造方法の提供。

【解決手段】 LOC技術とBGA技術を融合させることで二つのチップを同一のIC素子中に積み重ね、そのうちの一つのチップでは、リードフレームのリードをチップ上の回路と外界を連結するインタフェースとなし、もう一つのチップでは、錫球をチップ上の回路と外界を連結するインタフェースとなし、且つこれら二つのチップをリードフレームで支持固定することで、従来のBG A技術に必要であった基板素子を省略する。こうして二つのチップにそれぞれ異なる或いは同じ機能を持たせることができるようにすると共に、全体の構造を簡素化し、製造工程を容易とし、製造コストを下げ、並びにIC素子の全体面積、長さをいずれも従来の技術より縮小する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のチップとされて、いずれも一つの 作動面と一つの非作動面を有して、各チップの作動面そ れぞれに複数のボンディングパッドが設置されてチップ 上の回路と外界を連結するインタフェースとされる、上 記複数のチップ、

1

一つのリードフレームとされて、複数のリードを具え、 該第2チップの作動面の複数のボンディングパッドが一 つの技術手段によりそれぞれ対応するリードに連結され る一方、該第1チップの非作動面が該リードフレームに 10 結合される、上記リードフレーム、

複数の半田バンプとされて、第1チップの作動面の対応 する上記ボンディングパッドに連接される、上記複数の 半田バンプ、

モールド樹脂とされ、前述の複数のチップを封止して一 体の半導体パッケージとなすと共に、該複数のリードと 半田バンプを外部に露出させて外界との連結のインタフ ェースとなす、上記モールド樹脂。以上を包括して構成 された多チップ半導体パッケージ。

【請求項2】 前記ボンディングパッドがA1パッドと されたことを特徴とする、請求項1に記載の多チップ半 導体パッケージ。

【請求項3】 前記第2チップのボンディングパッドと 対応するリードを連接する技術手段がボンディングワイ ヤとされたことを特徴とする、請求項1に記載の多チッ プ半導体パッケージ。

【請求項4】 前記第2チップのボンディングパッドと リードを連結する技術手段として、前記第2チップのボ ンディングパッドが直接対応するリードに溶接され、そ れにより第2チップがリードフレームに結合、固定され 30 ることを特徴とする、請求項1に記載の多チップ半導体 パッケージ。

【請求項5】 前記第2チップの非作動面と第1チップ の非作動面の間がエポキシで結合されていることを特徴 とする、請求項1に記載の多チップ半導体パッケージ。

【請求項6】 前記第1チップの非作動面が熱溶性の両 面テープでリードフレームの第2チップと結合していな い一側面に結合されていることを特徴とする、請求項1 に記載の多チップ半導体パッケージ。

【請求項7】 前記第1チップの回路が直接第2チップ の回路と結合しておらず、リードフレームのリードが直 接半田バンプと結合していないことを特徴とする、請求 項1に記載の多チップ半導体パッケージ。

【請求項8】 前記第1チップと第2チップが異なる機 能を有するチップとされたことを特徴とする、請求項1 に記載の多チップ半導体パッケージ。

【請求項9】 作動面と非作動面を有する複数のチップ を封止してある多チップ半導体パッケージの製造方法に おいて、以下のaからfのステップ、即ち、

のリードフレームを結合するステップ

- b. 第2チップの非作動面を第1チップの非作動面に結 合するステップ
- c. 第2チップの作動面を、第1チップの上記リードフ レームのリードに連接するステップ
- d. 第1チップ21の作動面の適当な位置に複数の内バ ンプを植え込んでからモールド樹脂で第1チップと第2 チップを封止すると共に、該リード及び内バンプの少な くとも一部を樹脂の外に露出させるステップ
- e. 複数の半田バンプを複数の内バンプの位置に植え込
  - f. リードを折り曲げて半田バンプの方向に所定の角度 と長さに延伸させるステップ、

以上を包括する多チップ半導体パッケージの製造方法。

【請求項10】 作動面と非作動面を有する複数のチッ プを封止してある多チップ半導体パッケージの製造方法 において、以下のaからfのステップ、即ち、

- a. 第2チップの作動面の適当な位置に複数の導電性の 溶接材を植え込むステップ
- b. 第2チップの複数の溶接材を溶接方式でリードフレ 20 ームの対応するリードに結合させるステップ
  - c. 第1 チップの非作動面を該リードフレームの第2チ ッパと反対の側面に結合させるステップ
  - は、第1チップの作動面の適当な位置に複数の内バンプ を植え込み、並びに樹脂で第1チップと第2チップを封 止し、且つリード及び内バンプの少なくとも一部を樹脂 の外に露出させるステップ
  - e. 複数の半田バンプを複数の内バンプの位置に植え込 むステップ
- f. リードを折り曲げてフォーミングし、リードを半田 バンプの方向に延伸させて所定の角度、長さ及び形状と なすステップ

以上を包括する多チップ半導体パッケージの製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一種の多チップ半導 体パッケージ構造とその製造方法に関し、特に、二つ以 上の、同じ或いは異なる機能を有するチップを同一パッ ケージ中に積み重ね、且つそのうちの一つのチップにつ 40 いてはリードフレームのリードを外界とのインタフェー スとし、もう一つのチップについては半田バンプを外界 とのインタフェースとなした多チップ半導体パッケージ 構造とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造においては、いかに小さいパ ッケージ中に多くのロジック回路を詰め込んで相対的に 製造コストを下げるか、ということが製造業者の一致し た研究課題とされている。ゆえにこの領域の研究、競争 は非常に激烈となっており、チップ上の回路を縮小して a. 第1チップの非作動面に複数のリードを具えた一つ 50 最小素子寸法とする方法以外に、最低コストで直接単一

の半導体パッケージのメモリ容量を倍増する方法として、同一パッケージ中に2片以上のチップを包装する方 法がある。

【0003】図1には従来の多チップ半導体パッケージ 構造の例が示される。それは、LOC技術で2片のチッ プ1a、1bをホットメルト両面テープ2a、2bでそ れぞれ別々のリードフレーム3a、3b上に結合し、並 びに金線4a、4bを使用したリードボンディングによ りチップ1a、1bの回路とリードフレーム3a、3b の対応するリードとを連接し、最後にモールド樹脂で封 10 止5し、一体の半導体パッケージ素子(IC)を形成し ている。しかし、このように単純にリードフレームのリ ード6を複数のチップ1a、1bと外界とのインタフェ ースとすることの最大の欠点は、リード6数が倍増する ため、半導体パッケージ素子の長さがリードの数の増加 につれて増加したことである。最近のシングルチップパ ッケージ素子 (例えば4MB DRAM IC) のピン 数はすでに過去の20対から30対から、現在の42対 から50対となっている。各一対のピンはいずれもその 固定された幅を有するため、1 C素子は不断に長く、大 20 きくなり、もし図1の技術を以て多チップのパッケージ を進行するならば、ピン数は80対から100対以上に もなり、あまりにも長さが増して実用的でなくなってし まう。

【0004】図2に示されるのは、もう一種の従来の多 チップ半導体パッケージ構造の例であり、それは、BG A技術を採用して、二つのチップ7a、7bをエボキシ で相互に結合した後にさらに一つの基板8上に接着し、 並びに金線9a、9bでチップ7a、7b上の回路と基 板8の対応するボンディングパッドが連接された後、基 30 板8上の回路設計或いは基板8を貫通する導電プラグ設 計により、チップフa、7b上の電気回路が金線9a、 9bを透過して基板8の底面の対応する半田バンプ10 上に連接し、こうして一体の半導体パッケージ素子(I C)が形成されている。ただし、このように単純に、B GA技術の基板8の半田バンプ10を複数チップ7a、 7 b上の回路と外界とのインタフェースとすることの最 大の欠点は、基板8の面積が増大するために該半導体パ ッケージ素子の面積が非常に大きくなり、且つ工程上多 くの不便があり実施が困難であることである。現在のB GA技術ではいずれも一つの基板8でチップを支持、固 定し、さらに基板8の底面に設けられた半田バンプを信 号伝送の接点となしているため、基板の面積は一般に実 際のチップの寸法より少なからず大きくなり、さらに複 数チップの積み重ねは半田バンプの数量と基板面積を増 加させ、実用上が相対的に下がった。このように単純 に、BGA技術により複数チップを積み重ねることのも う一つの欠点は、製造工程上の難しさであり、例えば図 2に示される構造では、その上のチップ7aと基板8の 間を連接する金線9aがほぼ金線9bの2倍の長さとな 50 4

り、このように長すぎる金線9aはボンディングが非常に難しく、且つ外力或いは過熱(抵抗値が比較的大きいことによる)により極めて断線しやすかった。且つ、このような構造におけるチップ7aの寸法はその下のチップ7bより小さくなければならず、二つの同じ寸法或いは規格のチップを積み重ねることはできず、設計上の困難がもたらされた。このほか過長で密集する金線9a、9bが封止時に、樹脂による衝撃を受けて脱落し回路が遮断されることがあるため、歩留りが悪くなり、実施に向かなかった。

【0005】ゆえに、上述の各種の従来の技術は、実際的に、完全には半導体素子寸法の縮小と製造コストの削減という要求を満足させることができず、改善の必要があった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、一種の多チップ半導体パッケージ構造とその製造方法を提供することを課題とし、本発明により構造が簡単で、製造が容易であり、製造コストが低く、且つ I C素子の全体面積、長さを従来の技術より縮小できる提供される多チップ半導体パッケージを提供できるものとする。

【0007】本発明は一種の多チップ半導体バッケージ 構造とその製造方法を提供することを課題とし、それは LOC技術とBGA技術を融合して二つのチップを同一 の1C素子中に積み重ね、前述の従来の技術の数々の欠 点を解決すると共に、該二つのチップにそれぞれ同じか 或いは異なる機能を持たせられるようにする構造と製造 方法であるものとする。

## [0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、複数 のチップとされて、いずれも一つの作動面と一つの非作 動面を有して、各チップの作動面それぞれに複数のボン ディングパッドが設置されてチップ上の回路と外界を連 結するインタフェースとされる、上記複数のチップ、一 つのリードフレームとされて、複数のリードを具え、該 第2チップの作動面の複数のボンディングパッドが一つ の技術手段によりそれぞれ対応するリードに連結される 一方、該第1チップの非作動面が該リードフレームに結 合される、上記リードフレーム、複数の半田バンプとさ れて、第1チップの作動面の対応する上記ボンディング パッドに連接される、上記複数の半田バンプ、モールド 樹脂とされ、前述の複数のチップを封止して一体の半導 体パッケージとなすと共に、該複数のリードと半田バン プを外部に露出させて外界との連結のインタフェースと なす、上記モールド樹脂。以上を包括して構成された多 チップ半導体パッケージとしている。

【0009】請求項2の発明は、前記ボンディングパッドがA1パッドとされたことを特徴とする、請求項1に記載の多チップ半導体パッケージとしている。

50 【0010】請求項3の発明は、前記第2チップのボン

ディングパッドと対応するリードを連接する技術手段が ボンディングワイヤとされたことを特徴とする、請求項 1に記載の多チップ半導体パッケージとしている。

【0011】請求項4の発明は、前記第2チップのボン ディングパッドとリードを連結する技術手段として、前 記第2チップのボンディングパッドが直接対応するリー ドに溶接され、それにより第2チップがリードフレーム に結合、固定されることを特徴とする、請求項1に記載 の多チップ半導体パッケージとしている。

【0012】請求項5の発明は、前記第2チップの非作 10 動面と第1チップの非作動面の間がエポキシで結合され ていることを特徴とする、請求項1に記載の多チップ半 導体パッケージとしている。

【0013】請求項6の発明は、前記第1チップの非作 動面が熱溶性の両面テープでリードフレームの第2チッ プと結合していない一側面に結合されていることを特徴 とする、請求項1に記載の多チップ半導体パッケージと している。

【0014】請求項7の発明は、前記第1チップの回路 が直接第2チップの回路と結合しておらず、リードフレ 20 ームのリードが直接半田バンプと結合していないことを 特徴とする、請求項1に記載の多チップ半導体パッケー ジとしている。

【0015】語が項8の発明は、前記第1チップと第2 チップが異なる機能を有するチップとされたことを特徴 とする、請求項1に記載の多チップ半導体パッケージと している。

【0016】請求項9の発明は、作動面と非作動面を有 する複数のチップを封止してある多チップ半導体パッケ ージの製造方法において、以下のaからfのステップ、 即ち、

- a.第1チップの非作動面に複数のリードを具えた一つ のリードフレームを結合するステップ
- b. 第2チップの非作動面を第1チップの非作動面に結 合するステップ
- c. 第2チップの作動面を、第1チップの上記リードフ レームのリードに連接するステップ
- d. 第1チップ21の作動面の適当な位置に複数の内バ ンプを植え込んでからモールド樹脂で第1チップと第2 チップを封止すると共に、該リード及び内バンプの少な 40 くとも一部を樹脂の外に露出させるステップ
- e. 複数の半田バンプを複数の内バンプの位置に植え込 むステップ
- f. リードを折り曲げて半田バンプの方向に所定の角度 と長さに延伸させるステップ、

以上を包括する多チップ半導体パッケージの製造方法と している。

【0017】請求項10の発明は、作動面と非作動面を 有する複数のチップを封止してある多チップ半導体パッ ケージの製造方法において、以下のaからfのステッ

プ、即ち、

- a. 第2チップの作動面の適当な位置に複数の導電性の 溶接材を植え込むステップ
- b. 第2チップの複数の溶接材を溶接方式でリードフレ ームの対応するリードに結合させるステップ
- c. 第1チップの非作動面を該リードフレームの第2チ ップと反対の側面に結合させるステップ
- d. 第1 チップの作動面の適当な位置に複数の内バンプ を植え込み、並びに樹脂で第1チップと第2チップを封 止し、且つリード及び内バンプの少なくとも一部を樹脂 の外に露出させるステップ
- e. 複数の半田バンプを複数の内バンプの位置に植え込 むステップ

f. リードを折り曲げてフォーミングし、リードを半田 バンプの方向に延伸させて所定の角度、長さ及び形状と なすステップ

以上を包括する多チップ半導体パッケージの製造方法と している。

#### [0018]

【発明の実施の形態】本発明の多チップ半導体パッケー ジ構造の望ましい一つの実施例は、二つのチップ、即ち 第1チップと第2チップと、複数のリードを具えたリー ドフレーム、複数の半田バンプ及び樹脂を少なくとも包 括する。各チップはいずれも作動面と非許動面を有し、 且つ各チップの作動面に複数のボンディングパッドが設 けられてチップ上の回路と外界との連結のインタフェー スとされている。第2チップの作動面上の複数の連接パ ッドは一つの技術手段によりそれぞれ対応するリードに 結合され、且つ第1チップの非作動面はリードフレーム 上に結合されている。該複数の当田バンプは直接第1チ ップの作動面上の対応する複数のボンディングパッド上 に連接される。該樹脂は前述のチップを封止して一つの 半導体パッケージ構造となすのに用いられ、該複数のリ ード及び半田ボールは樹脂外に露出して外界との連結用 のインタフェースとされている。本発明の多チップ半導 体パッケージ構造には従来のBGA基板の設置がなく 二つのチップがリードフレームにより支持、固定され ている)、このため1C素子の面積が大幅に縮小され、 二つのチップはリードと半田バンプを接点として利用し ているため、そのピン数は多すぎず、IC素子の長さは 比較的短く、且つ本発明の全体構造は簡単で製造が容易 であり、製造コストが比較的低い。

# [0019]

【実施例】本発明の提供する多チップ半導体パッケージ 構造とその製造方法では、LOC技術とBGA技術を融 合させることで二つのチップを同一のIC素子中に積み 重ね、そのうちの一つのチップでは、リードフレームの リードをチップ上の回路と外界を連結するインタフェー

スとなし、もう一つのチップでは、錫球をチップ上の回 50 路と外界を連結するインタフェースとなし、且つこれら

10

二つのチップをリードフレームで支持固定することで、 従来のBGA技術に必要であった基板素子を省略する。 こうして二つのチップにそれぞれ異なる或いは同じ機能 を持たせることができるようにすると共に、全体の構造 を簡素化し、製造工程を容易とし、製造コストを下げ、 並びにIC素子の全体面積、長さをいずれも従来の技術 より縮小することができる。

【0020】図3は本発明の多チップ半導体パッケージ 構造の望ましい一実施例を示している。 図4から図5は 図3に示される実施例の製造フローの望ましい実施例を 示す。

【0021】図3に示されるように、本発明の提供する 多チップ半導体パッケージ20は、複数のチップ、一つ のリードフレーム24、複数の半田バンプ27及び樹脂 26を含む。該複数のチップは本実施例では第1チップ 21と第2チップ22を包括し、各チップ21、22は いずれも一つの作動面211、221と非作動面21 2、222を有し、該作動面211、221はチップ2 1、22の回路設計のある一側の表面とされ、且つ各チ ップ21、22の作動面211、221の所定の位置に 複数のボンディングパッド213、223が設けられて チップ21、22の外部を連結するためのインタフェー スとされている。本実施例では該ボンディングパッド2 13、223は、A1或いはそれに代替可能な金属のパ ッドとされる。

【0022】該リードフレーム24は複数のリード24 1を具え、該第2チップ22の作動面211上の複数の ボンディングパッド213は一つの技術手段によりそれ ぞれ対応するリード241に連結され、且つ第1チップ 21の非作動面212はリードフレーム24上に結合し ている。本実施例では、第2チップ22のボンディング パッド223と対応するリード241との結合手段とし て金線などのボンディングワイヤ224が使用され、第 1チップ21の非作動面212は熱溶性の両面テープ2 3でリードフレーム24の第2チップ22をボンディン グしていない一側面に結合されている。当然、半導体技 術に習熟した者が以上の説明から容易に思いつくよう に、両面テープ23で第2チップ22と第1チップ21 を結合しうる。

【0023】複数の半田バンプ27は、それぞれ第1チ ップ21の作動面211上の対応する複数のボンディン グパッド213上に設置され、半田バンプ27とボンデ ィングパッド213の間に予め内ボール214が植え込 まれて半田バンプ27とボンディングパッド213を結 合させる介装物とされる。その後、モールド樹脂26で 封止を進行して前述の二つのチップ21、22を被覆し て一体の半導体パッケージ20となし、且つ複数のリー ド241と半田バンプ27は該樹脂26の外に露出して 外界との連結用のインタフェースとされる。

【0024】図3に示される構造によると、第2チップ 50

22がリードフレーム24のリード241を第2チップ 22上の回路と外界との連結のインタフェースとしてお り、第1チップ21は半田バンプ27を第1チップ21 上の回路と外界との連結のインタフェースとしており、 並びに第1チップ21と第2チップ22がいずれもリー ドフレーム24上に位置決めされて、従来のBGA技術 で必要であった基板素子が省略されている。ゆえに、本 発明により提供される多チップ半導体パッケージ20 は、図3に示されるように、全体体積が比較的小さく、 ピン数が適当でICの長さが過長とならず、少なくとも 従来の基板素子を設置したICの面積よりその面積が縮 小され、且つ構造と素子数量の簡素化により製造コスト 削減を達成しうる。このほか、該チップ21、22はそ れぞれ半田バンプ27とリード241をチップ上の回路 と外界との連結のインタフェースとしており、ゆえに第 1チップ21上の回路が直接第2チップ22上の回路と 結合され且つリード241が直接半田バンプ27と結合 されない時、該第1チップ21と第2チップ22は異な る機能のチップとされうる。例えば、第1チップ21が ロジック回路のチップとされて第2チップ22がメモリ 回路のチップとされうる。このように、同一IC中に同 時に数種類の異なる機能のチップを包括することで、I Cの設計及で使用弾性が大幅に増加する。当然、半導体 技術に習熟した者が以上の説明より容易に思いつくよう に、該第1チップ21と第2チップ22は同じ機能のチ ップとされうるほか、第1チップ21と第2チップ22 上の電気回路は直接或いは間接的に相互に結合されう

【0025】図4から図5は、図3に示される本発明の 望ましい多チップ半導体パッケージ構造の実施例の望ま しい製造フローの実施例であり、それは以下のaからf のステップを包括する。

a. 第1チップ21の非作動面212上に両面テープ2 3を利用して複数のリード241を具えた一つのリード フレーム24を結合する

b. 第2チップ22の非作動面222をエポキシ樹脂2 5で第1チップ21の非作動面212に結合する。

c. 第2チップ22の作動面211上のボンディングパ ッド213をボンディングワイヤ224を利用してリー ドフレーム24のリード241に連接し、第2チップ2 2上の回路をリード241で外界と連接可能とする。 d. 第1チップ21の作動面211上の適当な位置のボ ンディングパッド213に複数の内バンプ214を植え 込み、同時に樹脂26で第1チップ21と第2チップ2 2を封止して一つの半導体 I C素子を形成し、且つリー

を樹脂26の外に露出させる。 e. 複数の半田バンプ27を複数の内バンプ214の位 置に植え込んで第1チップ21上の回路を半田バンプ2 7を介して外界と連通させられるようにする。

ド241及び内バンプ214それぞれの少なくとも一部

f. リード241を曲げてフォーミングしリード241 を半田バンプ27のある方向に延伸して、所定の角度、 長さ及び形状を有するものとなし、必要時にはさらに複 数の I C間の切断分離工程を進行し、本発明の半導体パ ッケージ20を完成する。

【0026】図6は本発明の多チップ半導体パッケージ 40のもう一つの望ましい実施例を示し、図7から図8 はその製造フローを示す。

【0027】図6に示される実施例の多チップ半導体パ ッケージ(IC)構造も、同様に、二つのチップ、即ち 第1チップ41と第2チップ42、複数のリード441 を有するリードフレーム44、複数の半田バンプ47、 及び、第1チップ41と第2チップ42を封止する樹脂 46を包括する。これら第1チップ41、第2チップ4 2は同様に、ぞれぞれ一つの作動面411、421と一 つの非作動面412、422を具え、且つ各チップの作 動面411、421それぞれに複数のボンディングパッ ド413、423が設けられている。

【0028】該第1チップ41は図5に示される実施例 でも、両面テープ43によりリードフレーム44の一側 面上に接着されているが、しかし、この技術の分野に習 **熟した者であれば簡単に思いつけるように、第1チップ** 41をエポキシ樹脂でリードフレーム44上に持着する ことも可能である。リードフレーム44の、第まチップ 21と反対のもう一側面上に第2チップ42が結合さ れ、且つ第2チップ42の作動面421上のボンディン グパッド423は溶接材424(例えば半田バンプ)で 直接対応するリード441に連接され、これにより第2 チップ42がリードフレーム44に結合されると共に、 第2チップ42上の回路がリード441により外界と連 30 通可能となる。第1チップ41上のボンディングパッド 413には図3の実施例と同様、内バンプ414と半田 バンプ47が結合され、こうして第1チップ41上の回 路が半田バンプ47により外界と連接可能となる.

【0029】図7から図8は図6に示される実施例の製 造フローであり、以下のaからfのステップを包括す る。

a. 第2チップ42の作動面421の複数のボンディン グパッド423部分に導電性の溶接材424を植え込 tr.

b. 第2チップ42の複数の溶接材424を溶接方式で リードフレーム44の対応するリード441に結合させ て、リード441を第2チップ42上の回路と外界とを 連結するインタフェースとなし、リードフレーム44の 第2チップ42と反対のもう一側面の適当な位置に両面 テープ43を設置する。

c. 第1チップ41の非作動面412を該リードフレー ム44の両面テープ43に結合させ、第1チップ41を リードフレーム44に固定する。

d. 第1チップ41の作動面411の複数のボンディン 50 6 リード

グパッド413部分にそれぞれ内バンプ414を植え込 み、並びに樹脂46で第1チップ41と第2チップ42 を封止し、且つリード441及び内バンプ414の一部 を樹脂46の外に露出させる。

1.0

e. 複数の半田バンプ47を複数の内バンプ414の位 置に植え込み、半田バンプ47を第1チップ41の回路 と外界との連結のインタフェースとなす。

f. リード441を折り曲げてフォーミングし、リード 441を半田バンプ47の方向に延伸させて所定の角 度、長さ及び形状とし、本発明の多チップ半導体パッケ ージ構造を完成する。

# [0030]

【発明の効果】総合すると、本発明は多チップ半導体パ ッケージ構造とその製造方法を提供するものであり、そ れは、有効に従来の単純なLOC或いは単純なBGA技 術により製造された従来の多チップ半導体パッケージ構 造の有する問題、即ち、半導体の長さが長すぎ、面積が 大きすぎ、全体構造が複雑で、製造が難しく、コストが 高く、実用性が劣るなどの数々の欠点を解決する。且つ 本発明の多チップ半導体パッケージ構造は、同一IC中 に数種の異なる機能のチップを有するか或いは同一の機 能のチップを有するかを選択でき、これによりICの設 計及び使用弾性を大幅に増加することができ、またその 全体構造は非常に簡単で、体積面積及び長さがいずれも 小さく、製造が容易であり、コストが非常に低く、進歩 性を有し、産業上の利用価値を有しており、且つ新規性 を有している。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】従来の多チップ半導体パッケージ構造の実施例 図である。

【図2】従来の多チップ半導体パッケージ構造のもう一 つの実施例図である。

【図3】本発明の多チップ半導体パッケージ構造の望ま しい一つの実施例図である。

【図4】本発明の多チップ半導体パッケージ構造の製造 フローの実施例図である。

【図5】図4に続く本発明の多チップ半導体パッケージ 構造の製造フローの実施例図である。

【図6】本発明の多チップ半導体パッケージ構造のもう 40 一つの望ましい実施例図である。

【図7】本発明の多チップ半導体パッケージ構造の製造 フローのもう一つの実施例図である。

【図8】図7に続く本発明の多チップ半導体パッケージ 構造の製造フローの実施例図である。

#### 【符号の説明】

1a、1b、7a、7b チップ

3a、3b リードフレーム

4a、4b、9a、9b 金線

## 5 樹脂

12

# 8 基板

10 半田バンプ

20、40 多チップ半導体パッケージ

21、41 第1チップ

22、42 第2チップ

211、221、411、421 作動面

212、222、412、422 非作動而

213、223、413、423 ボンディングパッド

214、414 内バンプ

224 ボンディングワイヤ

23、43 両面テープ

24、44 リードフレーム

241,441 リード

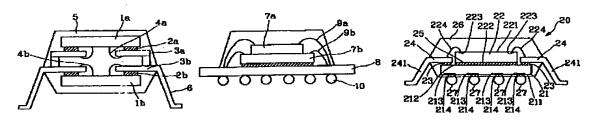
25 エポキシ樹脂

26、46 樹脂

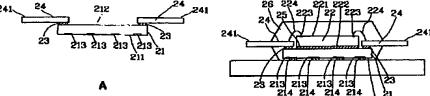
424 溶接材

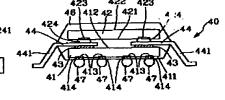
27、47 半田バンプ

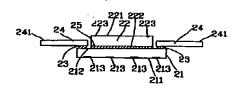
【図1】 【図2】 【図3】

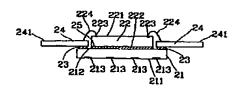


[図4]
【図5】

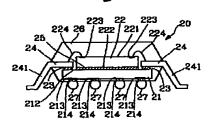






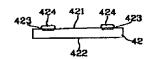


C

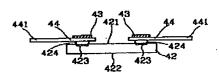


C

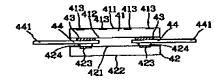
【図7】



### A

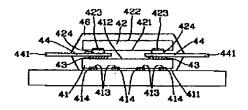


#### В



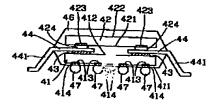
# C

# 【図8】



# 414 413 411 413 414 43 41 43 41 413 414 441 442 443 441 443 441

#### R



C